



西诺光学
XINUO PHOTONICS

PHASICS
The phase control company

SID4 UV

高性价比高分辨率紫外波前传感器

作为最低可至波长190 nm的高分辨率波前传感器，SID4 UV非常适合于紫外光学测量，包括用于光刻或半导体应用紫外激光表征，以及透镜和晶圆的表面面型检测。

应用: [激光工业](#) | [半导体](#) | [天文学](#) | [航空航天](#) | [AR/VR](#)

产品规格

波长范围	190 - 400 nm
靶面尺寸	7.78 x 7.78 mm ²
空间分辨率	21.92 μm
取样分辨率	355 x 355
相位分辨率	2 nm RMS
绝对精度	10 nm RMS
取样速度	> 30 fps
实时处理速度*	2 fps (全分辨率下)*
接口种类	以太网口
尺寸 (宽x高x长)	45 x 30 x 100 mm ³
重量	~ 250g

*使用官方配置电脑搭载SID4软件环境下

联系人: 王工
电话: 021-62488722-22
地址: 上海市长宁区华山路1336号玉嘉大厦16楼D座

手机: 18616772132 (微信同号)
邮箱: christy.wang@sinoptix.fr

